

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών εξαρτημάτων τερματισμού καλωδίων, (στοιχεία μη διαχωριστικά, διαχωριστικά & δεσμίδες προστασίας), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά από αίτηση με αριθμό πρωτ. 920903/2-10-96 της εταιρείας CENTRAL Co N. ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ. Ε.Ε ΦΟΙΝΙΚΗΣ 22-24 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 10447 ΤΗΛ. 3122585-3120262 από τον Τομέα Εργαστηρίων Δοκιμών Τερματικού Εξοπλισμού του Συγκροτήματος Ειδικών Εργαστηρίων.

Η μελέτη περιλαμβάνει:

- Συνθήκες δοκιμών,
- Τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Τα πρότυπα και οι κανονισμοί που χρησιμοποιήθηκαν:

- 1) ΕΛΟΤ 398.0
- 2) ΕΛΟΤ 398.1
- 3) RECOMMENDATION K.12 της CCITT.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ Τ.Ε.

Α. ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΜ/Τ-ΤΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ι. ΠΛΑΤΑΝΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΡΟΙΣΤ. ΣΥΓΚ. ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

3. ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Θερμοκρασία	: 25° C
Σχετική υγρασία	: 48 %
Ατμοσφαιρική Πίεση	: 762 mmHg
Χρόνος μετρήσεως δοκιμής	: 60 sec
Όργανο μετρήσεως	: HP-4339A (HIGH RESISTANCE METER)
Τάση δοκιμής	: 500 VDC
Ημερομηνία	: 11/10/96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

\underline{U} (V)	$\underline{R1}$ (MΩ)	$\underline{R2}$ (MΩ)	$\underline{R3}$ (MΩ)	$\underline{R4}$ (MΩ)	$\underline{R5}$ (MΩ)	$\underline{R6}$ (MΩ)	$\underline{R7}$ (MΩ)	$\underline{R8}$ (MΩ)
500	4×10^5	$4,4 \times 10^5$	$7,6 \times 10^5$	$1,4 \times 10^6$	4×10^5	$3,9 \times 10^5$	$6,3 \times 10^5$	9×10^5

R1-R8: Ηλεκτρική αντίσταση μόνωσης τυχαίων ορίων ως προς τα άλλα βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

\underline{U} (V)	$\underline{R1}$ (MΩ)	$\underline{R2}$ (MΩ)	$\underline{R3}$ (MΩ)	$\underline{R4}$ (MΩ)	$\underline{R5}$ (MΩ)	$\underline{R6}$ (MΩ)	$\underline{R7}$ (MΩ)	$\underline{R8}$ (MΩ)
500	$1,7 \times 10^6$	$1,4 \times 10^6$	$7,3 \times 10^5$	$7,6 \times 10^5$	1×10^6	$7,4 \times 10^5$	$1,4 \times 10^6$	$2,3 \times 10^6$

R1-R8: Ηλεκτρική αντίσταση μόνωσης τυχαίων ορίων ως προς γη.

4. ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ

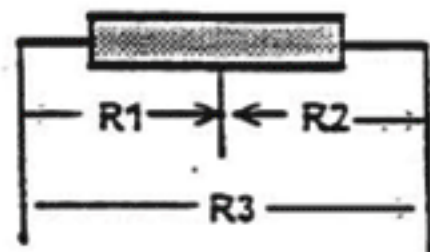
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Θερμοκρασία	: 25° C
Σχετική υγρασία	: 47 %
Ατμοσφαιρική Πίεση	: 762 mmHg
Χρόνος μετρήσεως δοκιμής	: 60 sec
Όργανο μετρήσεως	: HP-4339A (HIGH RESISTANCE METER)
Τάση δοκιμής	: 100 VDC
Ημερομηνία	: 11/10/96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

$\frac{U(100)}{(V)}$	$\frac{R1}{(M\Omega)}$	$\frac{R2}{(M\Omega)}$	$\frac{R3}{(M\Omega)}$
(95)230V	$5,3 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$	$9 \cdot 10^5$
230:95	$5,3 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$	$9 \cdot 10^5$
260:94	$5,3 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$	$9 \cdot 10^5$

ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ




σχήμα 1

R1-R3: Ηλεκτρική αντίσταση μόνωσης τυχαίου ορίου ως προς ένα άλλο (σχήμα 1).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ


Γ. ΣΚΛΗΡΙΔΗΣ
ΑΣΤ/Ρ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ


Ε. ΛΟΥΠΑΣ
ΥΠΟΤ/Τ-ΔΒ



INTRACOM

**TYPE TEST REPORT
CONNECTING BLOCK FOR
OVERVOLTAGE PROTECTORS 80-81-558**

Testreport Nr. : 9742E063T
Amendment :

PAGE : 1 of 7

TYPE TEST REPORT

OF

**CONNECTING BLOCK
FOR
OVERVOLTAGE PROTECTORS
80-81-558**

TEST REPORT ISSUE: 22-Oct-97

<input checked="" type="checkbox"/>	Approval - Test
<input type="checkbox"/>	Retest / Pretest
<input type="checkbox"/>	Mass Production Test
<input type="checkbox"/>	Technical Documentation



TYPE TEST REPORT
CONNECTING BLOCK FOR
OVERVOLTAGE PROTECTORS 80-81-558

Testreport Nr. : 9742E063T

Amendment :

PAGE : 5 of 7

INSULATION RESISTANCE

Test Date : 21-10-1997

Test Result : Pass

Test Level : 500 VDC

Criterion : > 10 M Ω

Test Equipment :

TYPE	MANUFACTURER	S/N
Insulation Tester TOS 7100M	Kikusui	10122520

Test Conditions :

AMBIENT TEMPERATURE	:	27°C
RELATIVE HUMIDITY	:	47%
BAROMETRIC PRESSURE	:	1030 mbar
TEST SITE	:	DV-LABORATORY

Insulation Resistance, Analytical Test Results

Test Level	Wave form	Polarity	Point of Application	Notes
1000 V	DC		Between each line and all other short circuited	> 2000 M Ω

DIELECTRIC STRENGHT

Test Date : 21-10-1997
Test Result : Pass

Test Level : 2000 VACrms

Test Equipment :

TYPE	MANUFACTURER	S/N
Withstanding Voltage Tester TOS 8700	Kikusui	10110835

Test Conditions :
 AMBIENT TEMPERATURE : 27°C

 RELATIVE HUMIDITY : 47%

 BAROMETRIC PRESSURE : 1030 mbar

 TEST SITE : DV-LABORATORY

Dilectric strenght, Analytical Test Results

Test Level	Wave form	Duration	Point of Application	Notes
2000 V	ACrms	1 min	each line and all other short circuited	Ok

